

利用設備追加届

年 月 日

分子科学研究所 機器センター長 殿

所 属
氏 名

[申請年度] 年度 (通年 ・ 前期 ・ 後期)

[申請番号]

[新たに利用希望する設備名]

- 電子顕微鏡 電界放出形走査電子顕微鏡(SEM)/JEOL JSM-6700F
- " 低真空分析走査電子顕微鏡(低SEM)/Hitachi SU6600
- " 電界放出形透過電子顕微鏡(TEM)/JEOL JEM-2100F
- X 線 単結晶X線回折/Rigaku MERCURY CCD-1・R-AXIS IV
- " 単結晶X線回折/Rigaku MERCURY CCD-2
- " 単結晶X線回折(微小結晶用)/Rigaku HyPix-AFC
- " 粉末X線回折/Rigaku RINT-UltimaIII
- " オペランド多目的X線回折/Malvern Panalytical EMPYREAN (要担当者事前確認)
- " X線溶液散乱計測システム/Rigaku NANO-Viewer
- 電子分光 機能性材料バンド構造顕微分析システム VG SCIENTA DA30
- " X線光電子分光/VG SCIENTA R4000L1, MX-650
- 電子スピン共鳴 ESR/Bruker E680 (要担当者事前確認)
- " ESR/Bruker EMX Plus
- " ESR/Bruker E500
- S Q U I D SQUID型磁化測定装置/Quantum Design MPMS-7
- " SQUID型磁化測定装置/Quantum Design MPMS-XL7
- 熱 分 析 示差走査型カロリメーター(溶液)/MicroCal VP-DSC
- " 等温滴定型カロリメーター(溶液)/MicroCal PEAQ-ITC
- " 等温滴定型カロリメーター(溶液)/MicroCal iTC200
- " 熱分析装置(固体・粉末)/Rigaku DSC8231/TG-DTA8122
- 質 量 分 析 MALDI-TOF質量分析/Bruker Microflex LRF
- 分 光 顕微ラマン分光/RENISHAW in Via Reflex
- " FT遠赤外分光/Bruker IFS66v
- " 蛍光分光/HORIBA SPEX Fluorolog3-21
- " 紫外・可視・近赤外分光光度計/Shimadzu UV-3600Plus
- " 絶対PL量子収率測定装置/HAMAMATSU Quantaaurus-QY C11347-01
- " 円二色性分散/JASCO J-1500
- レ ー ザ ー ピコ秒レーザー/Spectra-Physics, Quantronix Millennia-Tsunami, TITAN-TOPAS
- 高 磁 場 N M R 1H 800MHz/Bruker AVANCE800US
- " 1H 600MHz固体/Bruker AVANCE600
- " 1H 600MHz溶液/JEOL JNM-ECA600

センター長	設備担当者